Raport stiintific final proiect PD 84/2019

In projectul "Spectroscopie ultra-rapida rezolvata temporal pentru caracterizarea filmelor subtiri perovskitice" (UTRSCofPTF) a fost propusa o noua abordare care ofera posibilitatea caracterizarii proprietatilor filmelor subtiri din materiale oxidice perovskitice prin metoda spectroscopiei ultra-rapide rezolvate temporal, folosind pulsuri laser ultra-scurte intr-o configuratie de tip "pump-probe". Aceasta metoda combina doua domenii importante ale cercetarii, si anume: ingineria laserilor cu pulsuri ultra-scurte si caracterizarea proprietatilor filmelor subtiri. Totodata, aceasta abordare ofera o perspectiva unica asupra proceselor dinamice rapide, cu durate in domeniul fs-ps, ca urmare a imbinarii rezultatelor spectroscopiei optice cu imagistica spatio-temporala obtinuta cu ajutorul pulsurilor laser ultra-scurte, facând din aceasta metoda o modalitate de a diagnostica o varietate de fenomene asociate cu dinamica de transport si relaxare a purtatorilor de sarcina din structura nanomaterialelor. Scopul proiectului a fost de a dezvolta pentru prima data in Romania, in cadrul Institutului National de Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR) un montaj experimental de spectroscopie optica rezolvata temporal, cu rezolutie temporala mai mica de 100fs, bazat pe utilizarea pulsurilor laser ultrascurte generate de doua sisteme laser. Cele doua sisteme laser prezinta o tehnologie de amplificare a pulsurilor laser cu deriva de frecventa (CPA), si anume: sistemul laser TEWALAS (http://cetal.inflpr.ro/newsite/tewalas_system), a carui putere maxima este mai mare de 15 TW si etajul de amplificare incipient al sistemului laser CETAL-PW (http://cetal.inflpr.ro/newsite/pw_facility). In cadrul projectului propus se urmareste caracterizarea absorbtiei tranzitorii a filmelor oxidice perovskitice cu diferite grade de deformare structurala, obtinute prin tehnici de depunere asistata cu laserul, ceea ce va oferi informatii importante asupra modificarii proprietatilor optice in domeniul temporal fs-ps, ca urmare a excitarii optice.

Website: https://cetal.inflpr.ro/newsite/pd-84

Introducere

Spectroscopia optica cu rezolutie temporala ultrarapida are un impact semnificativ asupra unei mai bune Intelegeri a fenomenelor fizice si chimice cu o dinamica temporala ridicata In intervalul dintre femtosecunde (10⁻¹⁵ s) si picosecunde (10⁻¹² s). In plus, acesta este un domeniu de cercetare interdisciplinar, combinand o buna Intelegere a fizicii materialelor, ingineria laserelor, electronica Impreuna cu puternice notiuni de fizica fundamentala. Pentru caracterizarea fenomenelor fizico-chimice ultrarapide cu ajutorul luminii este nevoie de tehnici spectroscopice cu rezolutii temporale ridicate. Cu alte cuvinte, echipamentele folosite trebuie sa implice o componenta fizica care se schimba mai rapid decat procesul investigat.

Unul dintre elementele de dificultate ale acestei probleme este faptul ca fenomenele cu dinamica ultrarapida sunt greu de evidentiat. Astfel, pentru a le investiga, lumina trebuie sa fie controlata Intro maniera deosebit de precisa. Sursele de lumina care ofera un control fara precedent al proprietatilor luminii sunt laserele. Ele au fost inventate In anii 1960 de Maiman si de atunci au atins un nivel tehnologic cu care pot fi controlate multe caracteristici, cum ar fi: intensitatea, lungimea de unda, directia, durata pulsurilor, polarizarea si faza. Un pas extraordinar In fizica laserelor a fost facut prin descoperirea pulsurilor ultra-scurte si ultra-intense bazate pe tehnica Chirped Pulse Amplification (CPA) de catre profesorul Gerard Mourou In 1985 . Acesta a fost recompensat In 2018 cu Premiul Nobel pentru Fizica. Generarea pulsurilor laser ultrascurte prin tehnica CPA a deschis un nou domeniu de spectroscopie cu rezolutie temporala ultrarapida pentru nenumarate aplicatii In studiul proprietatilor electronice, optice, vibrationale si alte proprietati atomice precum si sisteme la scara moleculara, nano si de masa. Aplicatiile tehnicilor de spectroscopie optica liniara, cum ar fi absorbtia/transmisia UV-vizibila, reflexia si Imprastierea ofera informatii despre structura benzilor de electroni.

Unul dintre cele mai cercetate subiecte este dedicat filmelor epitaxiale ultrasubtiri de oxizi complecsi, functii principale si proprietati noi care pot fi utilizate pentru dezvoltarea de noi tehnologii pentru viitore aplicatii. Unele dintre aplicatiile importante ale filmelor subtiri In tehnologie si industrii includ: microelectronica, optoelectronica, comunicare, comunicatii cuantice, toate tipurile de senzori, cataliza. Prin urmare, impactul stiintei si tehnologiei filmelor subtiri asupra vietii moderne este enorma.

Importanta cercetarii proceselor ultrarapide – rezolvate temporal – ce apar in filmele feroelectrice subtiri atunci cand acestea sunt supuse iradierii optice si la diferite niveluri de deformare, este prezentata de cele mai recente rapoarte privind Imbunatatirea eficientei fotogenerarii In filmele subtiri BiFeO3. BiFeO3 este materialul perovskit ideal pentru studierea acestor fenomene, deoarece are proprietatile fizice necesare precum: un bandgap scazut, este ferroelectric si este antiferomagnetic la temperatura camerei. Mai mult, poate fi depus epitaxial prin metoda de depunere cu laser pulsat (PLD) si posibilele efecte flexoelectrice datorate iradierii laser ultrarapide pot fi observate si utilizate pentru cresterea gradientului de deformare In filmele subtiri. Prin urmare, obiectivul principal al acestei propuneri este de a demonstra diferentele nete In caracteristicile de absorbtie In timpul iradierii cu lumina ultrarapida ale filmelor subtiri epitaxiale de materiale perovskite, cu diferiti gradienti de deformare structurala indusi in timpul cresterii.

In acest proiect este propusa o noua abordare care ofera posibilitatea de a caracteriza proprietatile filmelor subtiri ale nanomaterialelor prin spectroscopie ultrarapida rezolvata temporal utilizand pulsuri laser ultrascurte intr-o configuratie de tip "pump-probe". Astfel, in cadrul proiectului sunt imbinate doua domenii importante de cercetare, dupa cum urmeaza: ingineria laser bazata pe pulsuri ultra-scurte si producerea si caracterizarea filmelor subtiri perovskitce. Aceasta abordare ofera informatii despre procesele dinamice rapide care au loc pe o scara de timp fs pana la ps, prin spectroscopiei optica cu pulsuri laser ultrarapide, facand acest lucru un mijloc pentru diagnosticarea unei game largi de fenomene asociate transportului purtatorilor de sarcina si dinamicii de relaxare In materiale la scara nanometrica.

Obiectivele proiectului au fost urmatoarele:

1. Dezvoltarea unui montaj optic pentru spectroscopie ultrarapida rezolvata temporal. Acest montaj este utilizat in cadrul proiectului pentru caracterizarea proceselor dinamice ultrarapide care apar atunci cand un puls scurt de pompaj optic interactioneaza cu filmele subtiri perovskitice. Aceasta configuratie experimentala este realizata pentru prima data la nivel national, dupa cunostintele noastre.

2. Evidentierea absorbtiei tranzitorii a filmelor subtiri perovskitice ca urmare a excitarii optice cu pulsuri ultrascurte.

Implementarea proiectului

In prima faza a proiectului a fost proiectat montajul experimental, prezentat in Fig.1, necesar pentru a putea realiza experimente de *spectroscopie ultra-rapida rezolvata temporal pentru caracterizarea filmelor subtiri perovskitice*.



Fig.1 Montajul experimental propus pentru experimentele de spectroscopie ultra-rapida rezolvata temporal.

Asa cum este prezentat in Fig.1 pulsurile laser ultra-scurte (aproximativ 50 fs figurate cu rosu) generate de sistemele laser vor fi impartite in doua; ulterior, un puls va fi utilizat pentru generarea unui puls de banda larga (figurat cu galben) al carui spectru este cuprins in intervalul (450-750nm) si acesta va fi folosit ca fascicul de proba, in timp ce al doilea puls (figurat cu albastru) va fi utilizat pentru excitarea optica a filmelor subtiri perovskitice in curs de investigare. Fasciculul utilizat pentru excitarea optica trebuie sa prezinte o intensitate mai mare, la nivelul tintei, decât fasciculul de proba deoarece produce modificari in structura filmelor subtiri de pervoskit. Pulsul de proba are rolul de a pune in evidenta modificarile generate de fasciculul de excitare optica si nu trebuie sa influenteze proprietatile probei investigate.

Pentru pulsul de excitare optica este prevazuta utilzarea a doua lungimi de unda diferite si anume: lungimea de unda fundamentala a sistemului laser CPA la 800 nm si armonica a doua la o lungime de unda de 400 nm. In Fig. 2 este prezentat spectrul unui puls de banda larga (supercontinuu) obtinut prin focalizarea unui puls laser ultra-scurt, generat de sistemul laser de 15TW TEWALAS, intr-o proba de sticla de siliciu. Latimea de banda spectrala a fasciculului de banda larga poate fi variata prin utilizarea de materiale cu indici de refractie neliniari diferiti. Pentru a obtine pulsuri de banda larga cu spectre diferite in cadrul proiectului au fost achizitionate materiale cu indici de refractie diferiti. Materialele achizitionate sunt din Safir si CaF2.



Fig.2 Spectru de banda larga obtinut la facilitatea laser TEWALAS

Intârzierea temporala dintre cele doua pulsuri va fi controlata cu ajutorul unei linii de intârziere optica motorizata pe care este amplasat un retroreflector. Suprapunerea temporala a pulsurilor laser ultra-scurte va fi obtinuta intr-un cristal dublor (BBO) amplasat in zona de interactie a pulsurilor la nivelul tintei asa cum este prezentat in Fig.3. Semnalul celei de-a doua armonici ce poate fi observat in mijlocul celor doua pulsuri fundamentale, generate de sistemul laser TEWALAS, reprezinta o suprapunere temporala a pulsurilor cu o rezolutie mai mica decât durata pulsurilor ultrascurte (50fs) utilizate.



Fig.3. Sincronizarea temporala a pulsurilor ultra-scurte

Filmele subtiri din material perovskit sunt excitate optic cu un puls ultra-scurt si modificarile obtinute in urma excitarii optice sunt investigate, la intervale scurte de timp (fs-ps), cu ajutorul unui puls ultra-scurt de banda larga. Dupa interactia pulsului de pompaj cu filmul subtire, se masoara intensitatea pulsului de proba. Conform legii absorbtiei, intensitatea pulsului de proba obtinuta pe tinta excitata este:

$$I_{exc} = I_0 * 10^{-A_{exc}}$$
(1)

 I_0 reprezinta intensitatea pulsului incident folosit pentru excitarea optica a probei si A_{exc} reprezinta absorbtia probei excitate.

In mod analog, când pulsul nu este excitat

$$I_{noexc} = I_0 * 10^{-A_{noexc}} \tag{2}$$

Impartind ecuatia (2) la (1) si prin logaritmarea ambelor parti ale ecuatiei, este obtinuta relatia:

$$\Delta A \equiv A_{exc} - A_{noexc} = lg \frac{I_{noexc}}{I_{exc}}$$
(3)

Conform relatiei (3) pentru a inregistra modificarile in absorbtie induse de pulsul de excitatie optica, nu este nevoie sa masuram intensitatea pulsului incident I₀. Intensitatea pulsurilor de proba va fi masurata folosind sisteme de detectie adecvate astfel incât intregul spectru poate fi inregistrat simultan. Semnalul ce pune in evidenta absorbtia tranzitorie a probei ca rezultat al excitatiei optice este in functie de timpul de intârziere dintre cele doua pulsuri si latimea de banda spectrala a pulsului de proba.

$$\Delta A = \Delta A(t,\lambda) \tag{4}$$

In aceasta faza a proiectului au fost realizate in proportie de 100% cele doua activitati propuse in cadrul proiectului si anume:

- Proiectarea si implementarea montajului experimental utilizat pentru spectroscopie ultrarapida;
- Generarea si caracterizarea pulsurilor de banda larga utilizate ca pulsuri de proba;

In cadrul acestei etape a fost implementat montajul optic experimental, proiectat in prima etapa a proiectului, pentru analiza absorbtiei tranzitorii a filmelor subtiric din material perovskit. Acesta a fost implementat si aliniat in cadrul laboratorului CETAL-PW din INFLPR, folosind ca sursa laser front-endul sistemului laser de 1 PW. In urma alimierii montajului experimental a fost realizata sincronizarea spatio-temporala a pulsurilor laser la nivelul tintei. Tot in cadrul acestei etape a fost dezvoltata o aplicatie in programul Labview, aceasta permitand controlul automat al sincronizarii temporale a pulsurilor, monitorizarii si achizitiei de date in timp real. Deasemenea, au fost fabricate si caracterizate din punct de vedere morfologic o serie de filme subtiri din material perovskit.

Descrierea stiintifica si tehnica

Pentru indeplinirea obiectivelor propuse in aceasta etapa au fost efectute urmatoarele studii:

- I. au fost obtinute si caracterizate din punct de vedere morfologic filme subtiri din material perovskit.
- II. a fost relizat montajul experimental pentru spectroscopie ulrarapida rezolvata temporal
- III. a fost realizata o aplicatie software in programul Labview pentru automatizarea montajului experimental si pentru achizitia de date in timp real;
- IV. a fost realizata suprapunerea spatiala si temporala a pulsurilor laser la nivelul tintei;

I. Producerea si caracterizarea filmelor subtiri din material perovskit prin depunere laser pulsata PLD

Filmele subtiri de tip heterostructuri din ferita de bismut (BiFeO₃ - BFO) si ferita de bismut dopata cu ytriu ($Bi_{0.97}Y_{0.03}FeO_3$ - BYFO) au fost obtinute cu ajutorul unui sistem experimental de depunere laser pulsata PLD, aflat in cadrul INFLPR si prezentat in figura de mai jos (Fig. 1):



Figura. 2. Sistemul de control al tintelor

Sistemul este format dintr-un laser, o incinta de depunere prevazuta cu un sistem multi-tinta (Fig. 2), sistem de pompe de vid cu ajutorul caruia se poate ajunge la presiuni de 10⁻⁶ mbari. In exteriorul camerei PLD sunt montate: sistemul de control al translatiei fasciculului laser, sistemul de control al tintelor si sistemul de control al cuptorului electric. Laserul utilizat pentru ablatia tintelor a fost un laser cu excimeri ArF (193 nm), energia (34 mJ) si frecventa (5Hz) fiind pastrate identice in cazul ambelor materiale oxidice.

Aceste materiale perovskitice au fost crescute pe substraturi monocristaline de titanat de strontiu dopat cu niobiu (STON) cu constante de retea similare (3,91Å pentru STON, 3,94Å pentru BYFO 3,96 pentru BFO), grosimea acestora fiind unul dintre parametrii experimentali ce a fost variat. Sistemul de tinte a permis depunerea alternativa a filmelor subtiri din fiecare material, utilizand acelasi numar de pulsuri (1.000), variind numarul de straturi depuse (3, 10 si 25), rezultand grosimi diferite pentru fiecare proba (Tabel 1). Temperatura de depunere in cazul ambelor materiale a fost 700°C, parametru experimental utilizat in literatura de specialitate pentru cresterea eficienta a BFO/BYFO pe substraturi monocristaline.

Proba	Tinta	Substrat	PO ₂	E(mj)/ arie	d _{t-c}	T_{substr}	N _{Puls}	v _{laser} (Hz)
			(mbar)	spot(mm)	(cm)	(⁰ C)		/
								$\lambda(nm)$
737	BFO/BYFO 3%	STON	0.13	42 out/18in/0,8	4	700	1.000/1.000	5/193
				mm^2			x 3	
738	BFO/BYFO 3%	STON	0.13	42 out/18in/0,8	4	700	1.000/1.000	5/193
				mm^2			x 25	
739	BFO/BYFO 3%	STON	0.13	42 out/18in/0,8	4	700	1.000/1.000	5/193
				mm^2			x 10	

In tabelul de mai jos sunt prezentate conditiile experimental in care au fost obtinute filmele subtiri:

Tabelul 1. Conditiile experimentale utilizate pentru obtinerea straturilor subtiri de BFO/BYFO

Analiza proprietatilor morfologice ale filmelor subtiri de BiFeO3 si BiYFeO3



Figura.3. Imagini AFM pentru filme subtiri de BFO/BYFO/STON avand grosimi diferite: a)1000/1000x3; b)1000/1000x10; c)1000/1000x25

Probele au fost analizate din punct de vedere morfologic utilizand microscopia de forta atomica, cu un sistem AFM XE100 (Park Systems). Variatia numarului de pulsuri conduce la diferente notabile in ceea ce priveste morfologia suprafetei straturilor subtiri de BFO/BYFO. In cazul probei 737 obtinuta in urma folosirii a 1000/1000 x 3 de pulsuri laser, suprafata este alcatuita din aglomerari de particule mici (20-30 nm). Pentru un numar de pulsuri laser mai mare (1000/1000 x 25), se constata o delimitare mai pronuntata a aglomerarilor de pe suprafata- Figura. 3 c). De asemenea, se constata aparitia unor particule mari cu dimenisuni de aproximativ 61 nm inaltime si 800 nm diametru pe suprafata filmelor subtiri ale probelor cu numarul 738 si 739.

Filmele subtiri au fost analizate si din punct de vedere al proprietatilor optice cu ajutorul spectroelipsometriei. Datele experimentale au fost achizitionate cu ajutorul software-ului VASE32 pe un interval spectral cuprins intre 250-1000 nm. Aceste date au fost fitate folosind un singur oscillator Gauss obtinand astfel atat valorile grosimilor filmelor cat si valorile si dispersia constantelor optice.

Proba	Grosime (nm)	Rugozitate (nm)
737	57.4	1.85
738	489.7	2.98
739	285.5	2.94

Tabelul 2. Valorile grosimii si rugozitatii masurate cu ajutorul spectroelipsometriei

Odata cu cresterea numarului de pulsuri este constatata o crestere a rugozitatii, de la aproximativ 2 nm pentru proba 737, pana 3 nm pentru probele, 738 si 739 (Tabelul 2).

Din punct de vedere al indicilor de refractie, pentru toate cele trei probe au fost obtinute valori caracteristice acestui tip de material, respectiv:

737			738			739		
400 nm	600 nm	800 nm	400 nm	600 nm	800 nm	400 nm	600 nm	800 nm
3,21	2,96	2,79	3,22	2,94	2,77	3,25	2,96	2,78

Tabelul 3. Valorile indicilor de refractie la 3 lungimi de unda λ =400 nm, 600 nm si 800 nm

In ceea ce priveste valorile coefiecintilor de exctinctie (Fig. 4) acestea sunt foarte apropiate pentru probele groase. Pentru proba cea mai subtire exista o diferenta, atat in forma curbei cat si in valorile lui "k" la lungimi de unda mai joase de 400 nm. Aceasta diferenta se poate pune pe seama

faptului ca structura cristalina in cazul acestei probe este distorsionata din cauza dopajului sau din cauza diferentei de retea intre substrat si film. In momentul in care grosimea creste stratul de BFO-BYFO incepe sa se relaxeze iar proprietatile optice devin caracteristice acestui tip de material. Varful in curba lui "k" de la 400 nm (3.1 eV) este caracteristic benzilor energetice introdus de Fe.



Figura 4. Valorile indicilor de refractie si ai coeficientilor de absorbtie pentru probele de BFO/BYFO/STON

II. Dezvoltarea si implementarea unui sistem de detectie si caracterizare a absorbtiei tranzitorii, a filmelor subtiri perovskitice, in timp real

In cea de-a doua etapa a proiectului a fost implementat montajul experimental necesar pentru a putea realiza experimente de spectroscopie ultra-rapida rezolvata temporal pentru caracterizarea filmelor subtiri perovskitice . Montajul experimental a fost realizat in cadrul laboratorui CETAL-PW din INFLPR. Ca sursa laser a fost folosit o parte din ftont-endul sistemului laser de 1 PW. Parametrii fasciculului laser utilizati in cadrul dezvoltarii montajului experimental sunt: putere 350mW, durata de puls 50 fs, rata de repetitie 1kHz, lungime de unda centrala: 808 nm.

Asa cum este prezentat in Figura 5 pulsurile laser ultra-scurte (aproximativ 50 fs figurate cu rosu) generate de sistemul laser sunt Impartite In doua cu ajutorul unui divizor de fascicul; ulterior, un puls este utilizat pentru generarea unui puls de banda larga (figurat cu galben) al carui spectru este cuprins In intervalul (450-650nm) si acesta va fi folosit ca fascicul de proba, In timp ce al doilea puls (figurat cu albastru) va fi utilizat pentru excitarea optica a filmelor subtiri perovskitice In curs de investigare. Fasciculul utilizat pentru excitarea optica trebuie sa prezinte o intensitate mai mare, la nivelul tintei, decat fasciculul de proba deoarece produce modificari In structura filmelor subtiri de pervoskit. Pulsul de proba are rolul de a pune In evidenta modificarile generate de fasciculul de excitare optica si nu trebuie sa influenteze proprietatile probei investigate.



Figura 5. Montajul experimental pentru spectroscopie utra-rapida rezolvata temporal. M-oglinzi metalice, L1-L5 lentile, DM- oglinzi dicroice 400/800, BS-divizor de fascicul, BBO-cristal dublor, T-tinta, a) spectrul fasciculului de proba, b) imagine a tintei obtinuta cu ajutorul microscopului optic.

Pentru pulsul de excitare optica este prevazuta utilzarea a doua lungimi de unda diferite si anume: lungimea de unda fundamentala a sistemului laser CPA la 800 nm si armonica a doua la o lungime de unda de 400 nm. Lungimea de unda de 400nm este obtinuta prin dublarea in frecventa intr-un cristal dublor BBO a pulsului laser cu lungimea de unda de 800nm. In Figura 5 este prezentat spectrul unui puls de banda larga (supercontinuu) obtinut prin focalizarea unui puls laser ultra-scurt, generat de sistemul laser de 1PW, intr-o proba de sticla de siliciu. Latimea de banda spectrala a fasciculului de banda larga poate fi variata prin utilizarea de materiale cu indici de refractie neliniari diferiti. Pentru a obtine pulsuri de banda larga cu spectre diferite In cadrul proiectului au fost achizitionate materiale cu indici de refractie diferiti. Materialele achizitionate sunt din Safir, YAG si CaF2.

III. Sincronizarea spatio-temporala a pulsurilor laser la nivelul tintei

Sincronizarea temporala dintre cele doua pulsuri este realizata cu ajutorul unei linii de intarziere optica motorizata pe care este amplasat un retroreflector. Pentru a putea pune in evidenta suprapunerea temporala a pulsurilor laser ultra-scurte a fost utilizat un cristal dublor (BBO) amplasat In planul de interactie a pulsurilor la nivelul tintei asa cum este prezentat in Figura 6. Aparitia semnalului celei de-a doua armonici ca urmare a suprapunerei spatiale si temporale a celor doua pulsuri in cristalul dublor reprezinta pozitia de 0 (suprapunere temporala cu o rezolutie mai mica de 50fs). Semnalul armonicii a doua este monitorizat cu ajutorul unei camera CCD si este prezentat in Figura 7.



Figura 6. Sincronizarea temporala la nivelul probei



Figura 7. Semnalul armonicii a doua (400nm) se afla in mijlocul celor doua fascicule a caror lungime de unda este de 800nm

Sincronizarea spatiala la nivelul tintei a fost monitorizata cu ajutorul unui microscop optic digital Microscop Digital Dino-Lite AF4115ZTL achizitionat in cadrul proiectului. In Figura 8 este prezentata o imagine obtinuta cu ajutorul microscopului optic si prezint suprapunerea spatiala a pulsurilor la nivelul tintei.



Figura 8. In partea din stanga sunt prezentate fasciculelel laser atunci cand nu sunt suprapuse spatial si in partea din dreapta sunt prezentate fasciculele laser atunci cand sunt suprapuse spatial.

IV. Automatizarea montajului experimental prin dezvoltarea de aplicatii software in programul LabVIEW

Unul dintre obiectivele proiectului a fost dezvoltarea unui program in Labview pentru monitorizarea si achizitia in timp real a datelor experimentale. In Figura 9 este prezentata interfata grafica a aplicatiei dezvoltate in cadrul proiectului. Cu ajutorul aplicatiei sunt relizate urmatoarele operatii:

- controlul intarzierii temporale a pulsurilor laser la nivelul tintei prin ajustarea pozitiei retroreflectorului amplasat pe tranzlatia motorizata;

- achizitia si monitorizarea spectrului de banda larga al fasciculului de proba. Spectrul este achizitionat cu ajutorul unui spectrometru OceanOptics HR400CG UV-NIR.

- monitorizarea suprapunerii spatiale a pulsurilor in planul tintei

-monitorizarea semnalului armonicii a doua (400nm) pentru realizarea suprapunerii temporale a celor doua pulsuri



-salvarea datelor experimentale in timp real

Figura 9. Interfata grafica a aplicatiei in LabView dezvoltata pentru achizitia datelor in timp real.

In aceasta faza a proiectului au fost realizate in proportie de 100% activitatile propuse in cadrul proiectului si anume:

- Dezvoltarea si implementarea unui sistem de detectie si caracterizare a absorbtiei tranzitorii, a filmelor subtiri perovskitice, in timp real
- Sincronizarea spatio-temporala a pulsurilor laser la nivelul tintei
- Automatizarea montajului experimental prin dezvoltarea de aplicatii software in programul LabVIEW

In cadrul proiectului a fost realizat un experiment ce a avut ca scop largirea spectrala a pulsurilor laser ultrascurte ca urmare a interactiei acestora cu filme subtiri polimerice (cyclic olefin polymer-COP, marca ZeonorFilmTM) si tinte subtiri de sticla (fused silica - FS). Au fost facute studii comparative pentru a evidentia care din cele doua materiale ofera cea mai mare largire spectrala si ulterior cea mai scurta durata de puls.

Raspunsul neliniar al filmelor subtiri folosite

Dependenta de intensitate neliniara a indicelui de refractie a materialelor $n(t) = n_0 + n_2 \cdot I(x, t)$ depinde de intensitatea pulsului *I* care este dependenta de timp si da nastere la automodularea de faza (SPM) pe masura ce pulsurile laser se propaga pe o lungime de interactiune Δz intr-un material, datorita schimbarii rapide a intensitatii pe durata pulsului. In cazul unui fascicul cu profil plat, in care variatia spatiala a intensitatii pulsului este minimizata, deplasarea spectrala indusa $\delta \omega_{rel}$ in raport cu frecventa fundamentala ω_0 este de asteptat sa fie uniforma de-a lungul profilului de intensitate al pulsului si este derivata din definitia frecventei unghiulare instantanee $\omega(t) = \omega_0 + \delta \omega_{rel}(t)$. Deplasarea spectrala este astfel de asteptat sa fie proportionala cu $\frac{\partial I}{\partial t}$ prin definitia lui $\omega(t) = \frac{d\phi}{dt}$, unde $\phi = \omega_0 t - kz$ pentru vectorul de unda $k = k_0 n(t)$, sau

$$\delta\omega_{rel}(t) = \omega(t) - \omega_0 = \frac{d\phi}{dt} - \omega_0 = k_0 n_2 \frac{dI(t)}{dt} \Delta z$$

Deoarece intensitatea pulsului are o anvelopa temporala Gaussiana, este de asteptat ca variatia in timp a profilului de intensitate a pulsului sa varieze deoarece $\frac{dI(t)}{dt} \sim I_0 / \tau_p$, unde intensitatea de vârf este estimata prin energia pulsului de intrare E_p , durata pulsului τ_p , si aria efectiva a pulsului A_p prin relatia $I_0 \propto E_p/(\tau_p \cdot A_p)$ [1]. O estimare a largimii de banda dupa extinderea spectrala poate fi apoi estimata din Eq. 1 in ceea ce priveste cantitatile de fascicul usor masurate,

$$\delta\omega_{rel} = k_0 n_2 z \frac{dI(t)}{dt} \bigg|_{max} \propto \frac{k_0 n_2}{\tau_p^2 A_p} (E_p \cdot \Delta z)$$

Este investigat raspunsul COP, mentinând constanta cantitatea de film la sase treceri si variind energia pulsului pentru a vedea raspunsul la schimbarea intensitatii laser. Amplitudinea spectrala a pulsului (rosu) si faza (verde) masurate cu WIZZLER sunt prezentate in Figura 3(a) ca o functie a energiei de intrare. Când este disponibil, spectrul de referinta este suprapus pe fundal gri. Acesta din urma a fost masurat cu FRM indepartat din linia fasciculului; sunt disponibile doar doua puncte de energie (Ep = 78,7 mJ si Ep = 157,9 mJ), cu valori ale energiei pulsului similare cu cele folosite la filmele COP.



Fazele pentru spectrele de referinta sunt plate, deoarece compresorul a fost ajustat in timpul experimentului pentru a furniza durata optimizata a pulsului. Curbele corespund valorilor medii. Banda umbrita indica incertitudinea estimata ca fiind jumatate din abaterea maxima dintre masuratori.

Figura 3. Spectrele masurate si raspunsul de faza al pulsului care trece prin sase straturi de film COP sunt prezentate in (a). Energia pulsului creste de la stanga sus la dreapta jos, corespunzator cu 35 mJ, 76 mJ, 116 mJ si, respective 158 mJ. Suprapuse in gri sunt spectrele originale masurate fara material

prezent in calea fasciculului. In (b), sunt prezentate spectrele si faza masurate folosind o placa de siliciu topita (FS). Raspunsul masurat al filmului COP este comparat cu FS in (c). Latimea de banda indusa ($\delta \omega_{rel}$) in raport cu latimea de banda de referinta initiala $\Delta \omega_0$ a pulsului de intrare este prezentata fata de parametrul ξ . O regresie liniara efectuata asupra celor doua seturi de date este suprapusa masuratorilor (linie continua), precum si rezultatelor obtinute din simulari (linii intrerupte).

Latimea de banda a pulsurilor si valorile duratei sunt date in Tabelul 1 in functie de energia de intrare E_p . Pentru fiecare masuratoare, latimea de banda a pulsului este calculata ca RMS al spectrului Δv_{σ} . Pentru fiecare punct de energie, valoarea medie este apoi calculata, iar incertitudinea acesteia este estimata ca jumatate din abaterea maxima. O potrivire gaussiana este suprapusa duratei pulsului reconstruita, iar FWHM extras impreuna cu incertitudinea de potrivire sunt utilizate pentru a estima durata pulsului τ_p . Parametrii pulsului sunt prezentati si in functie de variabila de scalare $\xi \equiv \text{Ep} \cdot \Delta z$,

Film	$E_p [m]$	$\xi [J \cdot mm]$	$\Delta \nu_{\sigma} \ [\pm 0.4, THz]$	$\Delta \lambda_{FWHM} [\pm 2., nm]$	$\tau_p [fs]$
NA	all	-	4.1	21.	45.5
COP	35	0.025	4.6	24.	43.3
COP	76	0.054	5.9	30.	32.6
COP	116	0.081	7.2	37.	29.4
COP	158	0.112	9.2	47.	23.4
FS	143	0.071	4.9	25.	39.8
FS	182	0.091	5.4	28.	36.3
FS	240	0.120	5.9	30.	31.9
FS	296	0.148	6.4	33.	29.0

 Δz fiind grosimea tintei in milimetri. Cresterea (scaderea) asteptata este vazuta in tendinta pentru latimea de banda (durata pulsului) ca o functie a cresterii energiei pulsului de intrare cu o cantitate fixa de material. Durata pulsului rezultata de 23 fs este jumatate din durata pulsului initial de 45 fs in cazul cu cea mai mare energie, cu putine modificari in fascicul.

Tabelul 1. Parametrii de puls masurati pentru pulsul de referinta fara film instalat (NA), 6× COP cu grosimea efectiva totala de 0,69 mm si plachete de siliciu (FS).

Majoritatea acestor parametri $(f(k_0\tau_pA_p))$ depind de conditiile laserului si raman constanti pe tot parcursul experimentului, cu exceptia energiei variate a pulsului de intrare E_p si a distantei de interactiune Δz datorita grosimii materialului. Acest lucru simplifica dependenta multivariata de largirea spectrala a Ecuatiei 1 prin studierea largimii spectrale in functie de variabila $\xi \equiv Ep \cdot \Delta z$,

$$\delta\omega_{rel} \propto \frac{k_0}{\tau_p^2 A_p} \cdot n_2 \cdot (E_p \cdot z) \equiv C_L \cdot n_2 \cdot \xi$$

Din ecuatia simplificata 3, se asteapta o dependenta liniara a deplasarii frecventei in raport cu ξ din aproximarea presupusa. Panta poate fi separata in doi factori, n_2 dependent de material si factorul constant C_L care depinde de geometria pulsului laser $m = C_L \cdot n_2$. Aceasta demonstreaza ca largimea spectrala masurata pentru un anumit material ar trebui sa se potriveasca cu o linie dreapta in raport cu variabila ξ . Panta m a regresiei liniare este astfel proportionala cu n_2 pentru un material dat. Parametrul necunoscut n_2 al COP poate fi apoi estimat prin compararea pantei extrase m a raspunsului COP cu cea a materialului bine cunoscut siliciu (FS),= $m_{COP}/m_{FS} = n_2^{COP}/n_2^{FS}$. Spectrul si faza au fost astfel masurate utilizand o singura placa de siliciu cu grosimea de 0,5 mm la incidenta normala; doua exemple de spectre sunt prezentate in Figura 3(b) pentru diferite valori ale energiei pulsului, iar parametrii masurati sunt, de asemenea, prezentati in Tabelul 1.

Deplasarea spectrala maxima relativa datorata SPM ($\delta \omega_{rel}$) este aproximata din experiment scazand latimea de banda de referinta initiala ($\Delta \omega_0$) din latimea de banda masurata dupa SPM($\Delta \omega_{spm}$): $\delta \omega_{rel} - \Delta \omega_{spm} - \Delta \omega_o$. Comparatia deplasarii spectrale relative masurate pentru sase treceri de COP la o grosime de 0,1 mm (6× COP) cu o placa de siliciu la incidenta normala este prezentata in Fig. 3(c). Raspunsul filmului COP este semnificativ mai mare decat cel al siliciului. O regresie liniara este efectuata pe cele doua seturi de date si suprapusa masuratorilor sub forma de linii negre din Fig. 3(c). Raportul pantelor extrase din potrivirile liniare ale COP la datele de siliciu ($m_{COP}/m_{FS} = 2.3 \pm 0.1$) ofera acces la n_2^{COP} folosind valoarea cunoscuta pentru siliciu, $n_2^{FS} =$ 2.4×10^{-4} cm²/TW [2]. Prin urmare, valoarea n_2 pentru COP poate fi estimata a fi $n_2^{COP} = (2.3 \pm 0.2)$ n_2^{FS} ,

$$n_2^{COP} = (5.5 \pm 0.6) \times 10^{-20} m^2 / W$$

Estimarea simplificata utilizata pentru largimea spectrala relativa este o functie liniara a lui ξ si este prezentata in Figura 3(c) prin liniile negre solide cu panta extrasa pentru a nu se potrivi bine cu datele. Valoarea estimata a n_2^{COP} este apoi utilizata in simularile bazate pe pachetul de optica neliniara Python

pyNLO [3] si suprapusa pe datele experimentale din Figura 3(c) ca linii intrerupte. Simularea este capabila sa demonstreze mai bine comportamentul observat utilizand valorile respective pentru n_2 si luand in considerare pierderea de reflexie la fiecare suprafata datorita unghiului de incidenta (θ_i) cu fiecare film. Transmisia pentru o suprafata este calculata folosind ecuatiile Fresnel tipice pentru lumina p-polarizata ($T(\theta_i = 1 - R_p(\theta_i))$). Primele cinci filme COP au fost masurate cu $\theta_i = 50^\circ$ (T = 0.99/suprafata), in timp ce din cauza constrangerilor de spatiu filmul final a fost redus astfel incat $\theta_i = 23^\circ$ (T=0.93/suprafata). Intregul set de sase filme ar trebui sa aiba ca rezultat o transmisie totala, $T_{tot} = (0.99)^{10} \times (0.93)^2 = 0.78$. In general, fiecare film are o transmisie totata de 98% si daca filmul final ar fi fost la un θ_i similar, atunci $T_{tot} = (0.99)^{12} = 0.89$ pentru setul de sase filme. Pentru un film singular FS la incidenta normala, $T_{tot} = 0.96$.

Profilul spatial fasciculului laser in urma interactiei pulsurilor ultra-scurte cu filmele subtiri polimerice de COP

Cu camera care monitorizeaza campul apropiat pentru a detecta deteriorarea filmului subtire, trebuie luata in considerare capacitatea de a caracteriza dezvoltarea procesului de multi-filamentare din cauza instabilitatilor de modulatie din fascicul. In teoria castigului de instabilitate a modulatiei bazata pe undele in stare de echilibru, dimensiunea caracteristica, *d*, ar trebui sa creasca exponential in timpul propagarii pana la atingerea iesirii materialului sau pragul de deteriorare indusa de laser (LIDT) al materialului. Cand puterea de varf a pulsului depaseste puterea critica $P_{cr} = 3.79\lambda_0^2/(8\pi n_0 n_2)$ (~ 1.2 MW pentru COP la 810 nm), pulsurile intense cu moduri super-gaussiane sunt susceptibile la multi-filamentare prin instabilitatea modulatiei initiata de zgomot in profilul fasciculului [44,45]. Marimea caracteristica pentru amplificarea maxima a MI este data de parametrul $d \approx \left(\frac{2\pi P_{\sigma}}{l_0}\right)^{1/2}$ care, in cazul COP la $I_0 \approx 1.4 \times 10^{12}$ W/cm², ofera o dimensiune aproximativa a caracteristicii d ≈ 23 µm [6], care este mai mic decat sistemul de camp apropiat este capabil sa rezolve (46 µm cu doi pixeli). Imaginile de profil vor trebui dezvoltate in continuare pentru a captura mai bine dimensiunile esentiale ale caracteristicilor in raport cu primele etape de deteriorare. In Fig. 4(a), modificarea discreta a materialului cu treceri suplimentare ale filmului variaza de la o referinta fara pelicula, un singur film de 0.1 mm grosime, filme de 4×0.1 mm grosime si filme de 6×0.1 mm grosime aratand dezvoltarea a mult zgomot in ultimele treceri prin film. Cand a aparut deteriorarea materialului sau decolorarea, aceasta a aparut in trecerea finala a filmului, astfel incat deplasarile partiale ale materialului sunt suficiente pentru a reimprospata filmul.



Figura 4. Profilul fasciculului cu film COP. In (a) iesirile liniei centrale din imaginile din campul apropiat sunt comparate cu numarul tot mai mare de treceri de film de jos in sus: fascicul de referinta (fara film); o singura pelicula de 0.1 mm (care arata taierea abrupta in fascicul datorita montarii); 4×0.1 mm; si, respectiv, 6×0.1 mm. Energia de intrare este mentinuta la 160 mJ. In (b) focalizarea REF este afisata fara film subtire in fascicul, in timp ce (c) arata focalizarea dupa ce filmul $1 \times$ COP [0.1 mm] este plasat in fascicul. In (d), este prezentata comparatia cu/fara film in locul liniei orizontale de iesire, in timp ce (d) compara aceeasi energie de-a lungul axei verticale.

Deoarece studiul spectral multipass a fost efectuat cu un grad de calitate optica mai scazut al COP, focalizarea de la un singur film COP de inalta calitate este, de asemenea, luata in considerare pentru a demonstra efectul asupra focalizarii fasciculului. Imaginile de focalizare tipice fara film (Ref) si cu un singur film (COP \times 1) sunt prezentate in (b) si, respectiv, (c) din Figura 4. Iesirile de linie care compara directiile orizontale si verticale sunt date in (d) si (e) din Figura 4. Focalizarea nu este optimizata chiar inainte de introducerea filmului, dar nu exista o schimbare semnificativa in structura focalizarii odata cu includerea filmului. Detaliile profilurilor ar trebui clarificate in studii ulterioare prin implementarea unei oglinzi deformabile pentru o focalizare initiala imbunatatita, filme optice de

calitate superioara si un ansamblu imagistic dedicat caracterizarii spatiale a fasciculului laser cu o rezolutie mai buna.

Rezultatele acestor studii, care masoara compresia de la 45 fs pana la 23 fs la o fluenta a pulsului similara cu laserele PW de la ELI-NP, indica obtinerea compresiei cu cel putin un factor de doi pentru pulsurile cu putere de varf care contin energii de ordinul Joulilor. Acest lucru va imbunatati capacitatile noilor generatii de tehnologie laser de inalta energie prin comprimarea pulsurilor curente de 25 fs printr-un factor similar [4]. Scalabilitatea filmului COP pana la un diametru de 1 m face ca acest material sa fie potrivit pentru implementarea la incidenta normala, sau chiar la unghiu Brewster, pentru diametrele mari ale fasciculului sistemelor de 10 PW, de exemplu diametrul fasciculului de 55 cm la iesirea HPLS 10 PW. Simularile cresterii rezultate a latimii de banda pentru un puls cu o durata de 25 fs la fluentele corespunzatoare pentru sistemul laser HPLS 10 PW din cadrul ELI-NP sunt prezentate in Figura 5. Deoarece pulsul incepe la 25 fs, in comparatie cu 45 fs din cadrul experimentelor de la LASERIX, este necesar mai putin material. Simularea indica faptul ca trecerea de o data sau de doua ori prin filme cu grosimea de 0.10 mm sau 0.18 mm (etichetate in figura ca COP 0.10 mm COP 0.18 mm, COP 2×0.10 mm, respectiv COP 2×0.18 mm) este de asteptat sa se obtina o largire spectrala semnificativa, chiar suficienta pentru a suporta un puls cu o durata de sub 10 fs.



Figura 5. Raspunsul simulat al filmului COP obtinut dintr-o simulare 1-D in PyNLO pentru o durata initiala a pulsului de 25 fs. Cresterea indusa latimii de banda ($\Delta\omega$) in raport cu latimea de banda de referinta initiala $\Delta\omega_0$ a pulsului de intrare este prezentata in raport cu fluenta pulsului pentru exemple

cu un singur film si cu doua filme. Regiunea umbrita evidentiaza valorile care corespund fluentelor pulsului relevante de 80 - 100 mJ/cm². Punctele corespund la latimi de banda care accepta durate de puls ftl de 17,75 (•), 12,75 (•), 12,0 (\blacksquare), 8,25 (*) fs.

Ca un exemplu de design optimizat pentru un compresor COP, un puls cu durata de 25 fs care interactioneaza cu doua treceri ale unei pelicule de 0.18 mm grosime de COP la unghiul Brewster produce o latime de banda care accepta un puls cu o durata mai mica de 9 fs cu o mica compensare de numai -70 fs² in GDD. Aceasta valoare reduce provocarile pentru productia de oglinzi cu chirp si sugereaza, de asemenea, posibilitatea de a le inlocui cu oglinzi de banda larga conventionale cu GDD rezidual negativ. O alta posibilitate este utilizarea unei a doua placi subtiri cu grosimea de ordinul lungimii de unda in reflexie [4]. Deoarece designul consta din doar doua treceri, transmisia totala este de asteptat sa fie T_{tot} = $(0.99)^4 = 0.96$. Astfel de implementari ar permite pulsuri cu putere de varf mai mare de 20 PW.

Filmele termoplastice extrudate de calitate optica, cum ar fi COP, demonstreaza un potential foarte promitator pentru manipularea neliniara a fasciculelor de inalta energie cu diametre mari. Polimerul prezinta o uniformitate mai mare in grosime pentru un cost mult mai redus decat multe sticle, sau alte materiale rigide, la aceste dimensiuni. Rolele de film pot fi montate folosind un dispozitiv FRM pentru utilizare pe termen lung in cazul in care eventuala degradare necesita reimprospatarea materialului. O versiune extinsa a configuratiei poate fi demonstrata cu tehnologia existenta si, in combinatie cu gestionarea dispersiei adecvata si mai putin constransa, poate oferi acces practic la pulsuri cu putere de varf care depaseste 20 PW. Aceasta este o alternativa eficienta, alaturi de amplificarea neliniara [4] si metodele de combinare coerenta, pentru a genera lasere din clasa Exawatt.

Rezultatele obtinute in perioada derularii proiectului au fost trimise spre publicare la revista Photonics(factor de impact 2.536), asteptandu-se decizia finala a editorului ca urmare a doua recenzii pozitive obtinute de la doi referenti.

Bibligrafie:

1. Lassonde, P.; Mironov, S.; Fourmaux, S.; Payeur, S.; Khazanov, E.; Sergeev, A.; Kieffer, J.C.; Mourou, G. High energy femtosecond 354 pulse compression. Laser Physics Letters 2016, 13, 075401. doi:10.1088/1612-2011/13/7/075401. 355 Version June 21, 2022 submitted to Photonics 11 of 11

2. Taylor, A.J.; Clement, T.S.; Rodriguez, G. Determination of n2 by direct measurement of the optical phase. Optics Letters 1996, 356 21, 1812. doi:10.1364/ol.21.001812. 357

3. Hult, J. A Fourth-Order Runge – Kutta in the Interaction Picture Method for Simulating Supercontinuum Generation in Optical 358 Fibers 2007. 25, 3770–3775. 359

4. Bespalov, V.; Talanov, V. Filamentary Structure of Light Beams in Nonlinear Liquids. ZhETF Pisma 1966, 3, 471–476. 360

5. Rubenchik, A.M.; Turitsyn, S.K.; Fedoruk, M.P. Modulation instability in high power laser amplifiers. Optics Express 2010, 361 18, 1380–1388. doi:10.1364/OE.18.001380. 362

6. Voronin, A.A.; Zheltikov, A.M. Pulse self-compression to single-cycle pulse widths a few decades above the self-focusing 363 threshold. Physical Review A 2016, 94, 1–6. doi:10.1103/PhysRevA.94.023824. 364

7. Mironov, S.Y.; Wheeler, J.A.; Khazanov, E.A.; Mourou, G.A. Compression of high-power laser pulses using only multiple ultrathin 365 plane plates. Optics Letters 2021, 46, 4570. doi:10.1364/OL.438154. 366

 Li, Z.; Kato, Y.; Kawanaka, J. Simulating an ultra-broadband concept for Exawatt-class lasers. Scientific Reports 2021, 11, 151. 367 Number: 1 Publisher: Nature Publishing Group, doi:10.1038/s41598-020-80435-6.

> Director Proiect, Dr. Cojocaru Victor Gabriel